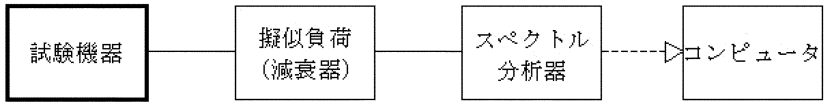
十二　副次的に発する電波等の限度

1　測定系統図



2　測定器の条件等

⑴　測定対象が低レベルであるため、擬似負荷（減衰器）の減衰量はなるべく低い値とする。

⑵　副次発射探索時のスペクトル分析器は以下のように設定する。

掃引周波数幅	副次発射の探索は、なるべく低い周波数から搬送波周波数の３倍以上までの周波数とする。
分解能帯域幅	１GHz未満では100kHz、１GHz以上では１MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Ｙ軸スケール	10dB／Div
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

⑶　副次発射測定時のスペクトル分析器は以下のように設定する。

中心周波数	探索された副次発射周波数
掃引周波数幅	０Hz
分解能帯域幅	30MHz未満では10kHz、30MHz以上１GHz未満では100kHz、１GHz以上では１MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Ｙ軸スケール	10dB／Div
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

3　試験機器の状態

⑴　試験周波数に設定する。

⑵　受信状態とする。

4　測定操作手順

⑴　スペクトル分析器の設定を２⑵とし、なるべく低い周波数から搬送波の３倍以上が測定できる周波数まで掃引して副次発射の振幅の最大値を探索する。

⑵　探索した結果が規格値以下の場合、探索値を測定値とする。

⑶　探索した結果が規格値を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を100MHz、10MHz及び１MHzのように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして副次発射の周波数を求める。次に、スペクトル分析器の設定を２⑶とし、平均化処理を行って平均電力を測定する。